

九州大学超顕微解析研究センター
文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業 九大ハブ機関 共催

第 237 回 HVEM研究会 のお知らせ

東北大学多元研の寺内正己先生をお招きし、下記の内容で講演会を開催致します。皆様、奮ってご参加下さい。

【日 時】 令和 6 年 10 月 16 日(水) 16:40 ~ 18:00

【会 場】 九州大学 伊都キャンパス
鉄鋼リサーチセンター2F

【講演内容】

電子顕微鏡を用いた物性解析技術
—軟 X 線発光分光を中心として—



電子顕微鏡は、原子直視を実現しただけでなく、材料全体の平均的測定ではわからない粒界・界面などの局所構造とマクロ物性の架け橋となる情報を提供してくれる。この意味で、材料開発・評価のサイクルに必須な実験技術である。そこでは、構造・組成の情報が主に使われている。近年は、もう一歩進め、局所の原子同士をつないでいる化学結合状態の情報を得る目的で、各種分光手法を組合わせた材料分析が行われるようになってきている。

本講演では、電子状態解析手法として電子顕微鏡で最近使われ始めた、電子線励起での軟 X 線発光分光法を中心に、開発から現状に至るまで、応用例、今後の装置進化について述べると共に、関連分光技術の動向についても触れる予定である。

当研究会についてのお問い合わせは、下記の連絡先をお願いいたします。

HVEM研究会世話人: 麻生 亮太郎 ・ 山崎 重人 ・ 嶋田 雄介
連絡先: 金子 賢治(九州大学大学院工学研究院 材料工学部門)
Tel & Fax: 092-802-2959 E-mail: kaneko.kenji.513@m.kyushu-u.ac.jp